

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 4 区分

【発行日】平成30年10月25日 (2018.10.25)

【公開番号】特開2016-62638(P2016-62638A)

【公開日】平成28年4月25日 (2016.4.25)

【年通号数】公開・登録公報2016-025

【出願番号】特願2015-178092(P2015-178092)

【国際特許分類】

G 1 1 B 5/39 (2006.01)

H 0 1 L 43/08 (2006.01)

【F I】

G 1 1 B 5/39

H 0 1 L 43/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成30年9月10日 (2018.9.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

読取器センサ積層体であって、

A F M 層と、

ピンド安定化層と、

ピンド層とを備え、

前記ピンド安定化層は、前記ピンド層よりも前記 A F M 層に近い位置に設けられ、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に設けられ、前記ピンド安定化層および前記ピンド層と当接する非磁性スペーサ層と、

基準層とを備え、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間の磁気結合は、前記ピンド安定化層と前記 A F M 層との間の磁気結合の 5 0 % 以下である、読取器センサ積層体。

【請求項 2】

前記ピンド安定化層は、2 n m 以下の厚さを有する、請求項 1 に記載の読取器センサ積層体。

【請求項 3】

前記 A F M 層とピンド安定化層とは、凹設される、請求項 1 に記載の読取器センサ積層体。

【請求項 4】

読取器センサ積層体であって、

A F M 層と、

2 n m 以下の厚さを有するピンド安定化層と、

ピンド層とを備え、

前記ピンド安定化層は、前記ピンド層よりも前記 A F M 層に近い位置に設けられ、

前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に設けられ、前記ピンド安定化層および前記ピンド層と当接する非磁性スペーサ層を備え、

前記スペーサ層は、前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に 0.15 erg/cm^2 の磁気結合を形成する、読取器センサ積層体。

【請求項 5】

読取器センサ積層体であって、
A F M 層と、
ピンド安定化層と、
ピンド層とを備え、
前記ピンド安定化層は、前記 A F M 層と前記ピンド層との間に設けられ、
前記ピンド安定化層と前記ピンド層との間に設けられ、前記ピンド安定化層および前記
ピンド層と当接する非磁性スペーサ層を備え、
前記ピンド安定化層は、1.5 nm 以下の厚さを有する、読取器センサ積層体。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

上述したすべての読取器センサ、たとえば読取器 150、200、300、400 A、
400 B およびその変形、ならびに上述したセンサ積層体、たとえば積層体 156、21
0 および変形は、めっき法、スパッタリング法、真空蒸着法、エッチング法、イオンミリ
ング法および他の堆積技術および処理技術を含むさまざまな方法の組合わせによって作製
されることができる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0044】

図 5 を参照して、フローチャートは、別のピンド層と A F M 層との間に介在するピンド
安定化層と非磁性スペーサ層とを有するセンサ積層体を備える読取器センサを形成するた
めの例示的な方法 500 を示す。方法は、基板上に下部シールド層を形成する動作 502
を含む。下部シールドと基板との間に介在材料 / 介在層が存在してもよい。この動作
において、下部シールドを基板上に直接形成する必要がない。動作 504 ~ 512 におい
て、積層体が下部シールド上に形成される。介在材料 / 介在層（たとえば、シード層）が
下部シールドとセンサとの間に存在してもよい。この動作において、積層体をシールド
上に直接直接形成する必要がない。動作 504 において、反強磁性層（A F M）が形成
される。動作 506 において、5 nm 以下の厚さを有するピンド安定化層が、A F M 層上に
直接形成され、A F M 層に当接する。動作 508 において、非磁性スペーサ層がピンド安
定化層上に直接形成され、ピンド安定化層と当接する。動作 510 において、ピンド層が
非磁性スペーサ層上に直接形成され、非磁性スペーサ層に当接する。センサ積層体の残り
の層は、動作 512 に形成される。この動作は、基準層、自由層、1 つ以上のスペーサ層
またはバリア層、および他の層の形成を含む。動作 504 ~ 512 のいずれかの動作また
はすべての動作を単一の工程（たとえば、堆積工程）に行うことができ、または動作 50
4 ~ 512 のうち任意の数の動作を組合わせることができ、任意の動作の間に別の動作を
介在してもよい。たとえば、凹状の A F M 層と凹状のピンド安定化層とを有するセンサ積
層体を形成する場合、動作 504 および 506 を単一の工程として行うことができる。そ
の後、フロントシールドを形成する。その後、動作 508、510 および 512 を単一の
工程として行うことができる。